PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1307);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab,

wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten.

2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya.
3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya.
4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya.
5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya.
6. Pemeriksa Paten adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Paten dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Paten.
10. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang paten.

11. Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Paten yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Paten.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan permohonan Paten.
(2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Paten yaitu melakukan pemeriksaan permohonan Paten yang meliputi pengelolaan dokumen permohonan Paten, pemeriksaan substantif permohonan Paten, dan penganalisisan hukum terkait dengan Paten.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
    a. Pemeriksa Paten Ahli Pertama;
    b. Pemeriksa Paten Ahli Muda;
    c. Pemeriksa Paten Ahli Madya; dan
    d. Pemeriksa Paten Ahli Utama.
(3) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, yaitu:
    a. Pemeriksa Paten Ahli Pertama:

1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pemeriksa Paten Ahli Muda:
1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pemeriksa Paten Ahli Madya:
1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Pemeriksa Paten Ahli Utama:
1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

(4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

(5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 6

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, antara lain:
a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
c. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;

d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Paten;
e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Paten;
f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Paten;
g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang Paten;
i. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;
l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
m. menyusun dan menetapkan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Paten; dan
n. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

(2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sesuai dengan jabatan, sebagai berikut:
a. Pemeriksa Paten Ahli Pertama, meliputi:
1. mencatat dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri yang diterima;
2. memilah dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan kategori;

3. memilah dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan bidang substansi;
4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
6. memberi label permohonan substantif Paten Sederhana normal dan permohonan substantif Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
7. menyusun dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan paten W dengan 3 (tiga) dokumen permohonan substantif klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri
8. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
9. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
10. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana normal;
11. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
12. menentukan invensi yang diajukan memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
13. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan Paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten Sederhana Normal;
14. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan Paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;

15. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
16. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
17. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
18. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
19. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
20. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
21. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
22. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
23. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
24. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
25. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
26. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
27. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
28. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
29. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
30. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
31. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
32. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;

33. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
34. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
35. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
36. menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
37. menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
38. menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter)* dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
39. menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter)* dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
40. menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention).* dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
41. menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention).* dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
42. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
43. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
44. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
45. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;

46. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
47. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
48. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
49. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
50. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
51. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
52. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
53. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
54. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
55. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
56. menentukan langkah-langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
57. menentukan langkah-langkah inventif dengan Mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
58. menentukan langkah-langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
59. menentukan langkah-langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;

60. menentukan langkah-langkah inventif dengan Menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
61. menentukan langkah-langkah inventif dengan Menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
62. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
63. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
64. membuat surat hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
65. membuat surat hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
66. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
67. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
68. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
69. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
70. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
71. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
72. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
73. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
74. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;

75. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
76. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
77. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
78. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten Sederhana normal;
79. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
80. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten Sederhana normal;
81. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri;
82. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;
83. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
84. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
85. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
86. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan
87. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.

b. Pemeriksa Paten Ahli Muda, meliputi:
   1. mencatat dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri yang diterima;
   2. memilah dokumen permohonan permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan kategori;

3. memilah dokumen permohonan permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandirisesuai dengan bidang substansi;
4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
6. memberi label permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
7. menyusun dokumen permohonan substantif Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, dokumen permohonan substantif Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri sesuai dengan urutan dan pemohon;
8. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
9. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
10. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
11. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;

12. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
13. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
14. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
15. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
16. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
17. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
18. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
19. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
20. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
21. menganalisis konsistensi uraian dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
22. menganalisis konsistensi uraian dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
23. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
24. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

25. menganalisis konsistensi penggunaan istilah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
26. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
27. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
28. menganalisis konsistensi satuan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
29. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
30. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
31. menganalisis konsistensi simbol dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
32. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
33. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
34. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
35. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
36. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
37. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
38. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
39. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

40. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
41. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
42. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
43. memeriksa kejelasan gambar invensi dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
44. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
45. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
46. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
47. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
48. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
49. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
50. menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
51. menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
52. menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;

53. menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter)* dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
54. menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter)* dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
55. menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter)* dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
56. menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention)* dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
57. menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention).* dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
58. menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention).* dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
59. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
60. melakukan pengklasifikasian dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
61. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
62. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
63. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
64. melakukan pengklasifikasian ulang dengan menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

65. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
66. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
67. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili Paten dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
68. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
69. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
70. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
71. melakukan penelusuran tambahan dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
72. melakukan penelusuran tambahan dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
73. melakukan penelusuran tambahan dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusurandalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
74. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten gandadalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
75. melakukan penelusuran tambahan dengan melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
76. melakukan penelusuran tambahan dengan Melakukan penelusuran internal untuk mencegah

terjadinya paten ganda dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;

77. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
78. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
79. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
80. menentukan langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
81. menentukan langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
82. menentukan langkah inventif dengan menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
83. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
84. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
85. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
86. menentukan langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
87. menentukan langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
88. menentukan langkah inventif dengan memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;

89. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
90. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
91. menentukan langkah inventif dengan mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah dalam pemeriksaan Paten Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
92. menentukan langkah inventif dengan menganalisis efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
93. menentukan langkah inventif dengan menganalisis efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
94. menentukan langkah inventif dengan menganalisis efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
95. menentukan langkah inventif dengan menentukan ketidakterdugaan *(non-obvious)* klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
96. menentukan langkah inventif dengan menentukan ketidakterdugaan *(non-obvious)* klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
97. menentukan langkah inventif dengan menentukan ketidakterdugaan *(non-obvious)* klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
98. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;

99. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
100. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
101. membuat surat hasil pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
102. membuat surat hasil pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
103. membuat surat hasil pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
104. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
105. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
106. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
107. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
108. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
109. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
110. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
111. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
112. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
113. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
114. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

115. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
116. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
117. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
118. melakukan diskusi dari isi komunikasi dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
119. memberikan keputusan (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri;
120. memberikan keputusan (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
121. memberikan keputusan (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri;
122. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri yang belum diproses;
123. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih yang belum diproses;
124. membuat surat penarikan kembali Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri yang belum diproses;
125. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri yang sedang dalam proses pemeriksaan;
126. membuat surat penarikan kembali Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih yang sedang dalam proses pemeriksaan;
127. membuat surat penarikan kembali Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri yang sedang dalam proses pemeriksaan;
128. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan tahap awal Pemeriksa Paten Pertama;
129. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan tahap lanjutan Pemeriksa Paten Pertama;
130. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan tahap akhir Pemeriksa Paten Pertama;
131. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan penarikan kembali Pemeriksa Paten Pertama;
132. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;

133. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
134. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
135. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
136. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan
137. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.

c. Pemeriksa Paten Ahli Madya, meliputi:
   1. mencatat dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif Paten Sederhana Lengkap yang diterima;
   2. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif Paten Sederhana Lengkap sesuai dengan kategori ;
   3. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap sesuai dengan bidang substansi;
   4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap;
   5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap;
   6. memberi label dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Substantif Sederhana Lengkap;
   7. menyusun dokumen permohonan substantif Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri,

permohonan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan Paten Sederhana Lengkap sesuai dengan urutan dan pemohon;

8. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
9. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
10. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
11. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
12. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
13. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
14. menentukan invensi yang diajukan memenuhi Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
15. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
16. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
17. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
18. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;

19. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
20. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
21. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
22. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
23. menganalisis konsistensi uraian Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
24. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
25. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
26. menganalisis konsistensi penggunaan istilah Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
27. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
28. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
29. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
30. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
31. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
32. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
33. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
34. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
35. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
36. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;

37. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
38. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
39. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
40. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
41. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
42. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
43. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
44. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
45. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
46. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
47. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
48. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
49. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
50. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, *product by process*, *second medical use*, metode bisnis, perangkat lunak komputer) pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
51. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;

52. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
53. menentukan persoalan pokok (*subject matter*) dari suatu invensi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
54. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
55. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*)pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
56. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter)* pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
57. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
58. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
59. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention)* pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
60. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
61. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
62. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
63. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam) pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
64. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
65. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;

66. Melakukan penelusuran untuk mendapatkan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
67. menentukan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*), dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
68. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
69. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili paten pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
70. melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili paten pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
71. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
72. melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
73. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
74. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
75. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
76. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
77. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
78. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
79. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (*closest prior art*) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;

80. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
81. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
82. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
83. mengidentifikasi masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
84. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
85. memformulasikan masalah dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
86. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
87. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
88. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
89. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
90. menentukan ketidak-terdugaan (*non-obvious*) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
91. menentukan ketidak-terdugaan (*non-obvious*) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
92. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
93. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

94. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
95. membuat surat hasil pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
96. membuat surat hasil pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
97. membuat surat hasil pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
98. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
99. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
100. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
101. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
102. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
103. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
104. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
105. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
106. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
107. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
108. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
109. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
110. melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;

111. melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
112. melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
113. melakukan Mediasi pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
114. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
115. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
116. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
117. memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain untuk pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
118. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
119. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
120. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
121. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri;
122. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
123. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap;
124. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda pada tahap awal;
125. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda pada tahap lanjutan;
126. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda pada tahap akhir;
127. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda untuk penarikan kembali;

128. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;
129. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
130. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
131. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penasehat (advisor) di lembaga-lembaga penelitian;
132. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai koordinator pemeriksa antar kantor paten;
133. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai Koordinator pemeriksa untuk mediasi paten;
134. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai ketua kelompok Pemeriksa Paten;
135. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim sistem inovasi nasional;
136. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim ekonomi kreatif;
137. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota dewan riset nasional;
138. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim koordinasi perizinan peneliti asing;
139. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji calon pemeriksa paten;
140. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa paten;
141. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim penerapan dan pengkajian teknologi;
142. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai juri lomba inovasi nasional;
143. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai tim pelaksanaan paten;
144. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
145. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan
146. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.

d. Pemeriksa Paten Ahli Utama, meliputi:
   1. mencatat dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih yang diterima;

2. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih sesuai dengan kategori;
3. memilah dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri mandiri atau lebih sesuai dengan bidang substansi;
4. memeriksa kelengkapan administrasi dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
5. memeriksa kelengkapan fisik dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
6. memberi label dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
7. menyusun dokumen permohonan substantif Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri sesuai dengan urutan dan pemohon;
8. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
9. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
10. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

11. menentukan permohonan Paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
12. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
13. menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
14. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
15. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
16. menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap, dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
17. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
18. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandirii;
19. menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
20. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
21. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
22. menganalisis konsistensi uraian pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
23. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

24. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
25. menganalisis konsistensi penggunaan istilah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
26. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
27. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
28. menganalisis konsistensi satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
29. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
30. menganalisis konsistensi simbol satuan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
31. menganalisis konsistensi simbol pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
32. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
33. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
34. menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
35. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
36. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
37. memeriksa jumlah kata di dalam abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
38. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
39. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
40. memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

41. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
42. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
43. memeriksa kejelasan gambar invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
44. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
45. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
46. memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
47. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
48. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
49. memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
50. menentukan persoalan pokok (subject matter) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
51. menentukan persoalan pokok (subject matter) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
52. menentukan persoalan pokok (subject matter) dari suatu invensi dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
53. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
54. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;

55. menentukan batasan-batasan invensi (*critical subject matter*) dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
56. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
57. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
58. menentukan satu kesatuan invensi (*Unity of invention*) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
59. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
60. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
61. menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
62. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
63. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
64. menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
65. melakukan penelusuran untuk mendapatkan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
66. melakukan penelusuran untuk mendapatkan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
67. melakukan penelusuran untuk mendapatkan dokumen-dokumen pembanding yang relevan

dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

68. menentukan dokumen pembanding terdekat (closest prior art), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
69. menentukan dokumen pembanding terdekat (closest prior art), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
70. menentukan dokumen pembanding terdekat (closest prior art), dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
71. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
72. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
73. melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
74. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (closest prior art) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
75. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (closest prior art) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
76. membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat (closest prior art) yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
77. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
78. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
79. menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, paten dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
80. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

81. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
82. mengidentifikasi masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
83. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
84. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
85. memformulasikan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
86. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
87. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
88. mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
89. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
90. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
91. menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
92. menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
93. menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
94. menentukan ketidak-terdugaan (non-obvious) klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;

95. menerapkan teori murni terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
96. menerapkan teori murni terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
97. menerapkan teori murni terhadap pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
98. mengevaluasi lingkup klaim pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
99. mengevaluasi lingkup klaim pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
100. mengevaluasi lingkup klaim pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
101. mengevaluasi perubahan/amandemen klaim-klaim terhadap permohonan asli pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
102. mengevaluasi perubahan/amandemen klaim-klaim terhadap permohonan asli pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
103. mengevaluasi perubahan/amandemen klaim-klaim terhadap permohonan asli pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
104. menentukan jika pemohon harus diminta untuk membatasi klaim-klaim terhadap invensi tunggal, bukan pluralitas klaim invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
105. menentukan jika pemohon harus diminta untuk membatasi klaim-klaim terhadap invensi tunggal, bukan pluralitas klaim invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
106. menentukan jika pemohon harus diminta untuk membatasi klaim-klaim terhadap invensi tunggal, bukan pluralitas klaim invensi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
107. mengenali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
108. mengenali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
109. mengenali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
110. memutuskan keadaan khusus dimana pemohon mencoba untuk membuat perubahan besar dalam

permohonan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

111. memutuskan keadaan khusus dimana pemohon mencoba untuk membuat perubahan besar dalam permohonan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
112. memutuskan keadaan khusus dimana pemohon mencoba untuk membuat perubahan besar dalam permohonan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
113. menentukan keefektifan dan/atau kegunaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
114. menentukan keefektifan dan/atau kegunaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
115. menentukan keefektifan dan/atau kegunaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
116. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
117. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
118. menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
119. membuat surat hasil pemeriksaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
120. membuat surat hasil pemeriksaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
121. membuat surat hasil pemeriksaan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
122. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
123. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
124. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
125. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;

126. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
127. menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
128. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
129. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
130. membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
131. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
132. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
133. menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
134. melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
135. melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;
136. melakukan diskusi dari isi komunikasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
137. melakukan Mediasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
138. melakukan Mediasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri;
139. melakukan Mediasi pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
140. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
141. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri;

142. membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali) dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
143. memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
144. memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri
145. memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
146. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
147. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan dengan 2 (dua) klaim mandiri
148. membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses dalam pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
149. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri;
150. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri
151. membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih;
152. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya tahap awal;
153. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya tahap lanjutan;
154. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya tahap akhir;
155. melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya penarikan kembali;
156. melakukan penelitian hukum untuk menentukan the state of law sehubungan dengan masalah hukum yang tidak biasa yang mungkin

berkembang dalam proses penuntutan atas permohonan;

157. mengevaluasi preseden kasus yang ditemukan dan menentukan penerapannya dengan kasus yang sedang ditangani;
158. mengevaluasi bukti kegunaan dan menentukan pemenuhan aturan hukum untuk tujuan pembuktian kegunaan;
159. menentukan satu dari beberapa permohonan paten yang sama yang diajukan oleh pemohon;
160. menentukan kelengkapan persyaratan keputusan (diberi atau ditolaknya) suatu permohonan paten berdasarkan keterangan-keterangan ahli yang disampaikan oleh pemohon;
161. mengevaluasi penjelasan pemohon dengan melakukan dengar pendapat (hearing);
162. mengevaluasi penjelasan pemohon dengan melakukan mempertimbangkan permintaan hak khusus;
163. mengevaluasi penjelasan pemohon dengan melakukan membuat keputusan mengenai penggunaan invensi tersebut sebelum dimohonkan patennya;
164. memberikan argumen pada Komisi Banding;
165. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di DPR;
166. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di Pengadilan;
167. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di Kepolisian;
168. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di KPPU;
169. menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten di intansi terkait lainnya;
170. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai panelis;
171. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai pembahas;
172. melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai sekretaris;
173. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penasehat (advisor) di lembaga-lembaga penelitian;
174. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai koordinator pemeriksa antar kantor paten;
175. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai Koordinator pemeriksa untuk mediasi paten;

176. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai ketua kelompok Pemeriksa Paten;
177. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim sistem inovasi nasional;
178. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim ekonomi kreatif;
179. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota dewan riset nasional;
180. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim koordinasi perizinan peneliti asing;
181. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji calon pemeriksa paten;
182. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa paten;
183. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai anggota tim penerapan dan pengkajian teknologi;
184. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai juri lomba inovasi nasional;
185. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai tim pelaksanaan paten;
186. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum nasional;
187. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pimpinan untuk forum internasional; dan
188. melaksanakan tugas internalisasi paten sebagai pelaksana harian.

(2) Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

(3) Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Paten diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

Pasal 9

(1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Paten yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa Paten lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

(2) Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

b. Pemeriksa Paten yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

Pasal 11

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Paten wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

(2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Paten, sesuai dengan jenjang jabatannya.

(3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

(4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 12

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

(1) Pengangkatan pertama kali PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten wajib memenuhi syarat:
   a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang kimia, biologi, farmasi, elektro, fisika, mesin, sipil, teknologi pertanian, teknologi perikanan, dan teknik di bidang *International Patent Classification* (IPC);
   b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
   c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.

(3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Pemeriksa Paten.

(5) PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional Pemeriksa Paten paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

(6) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten bagi PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan apabila bukan kesalahan PNS yang bersangkutan.

(7) Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 14

(1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten harus memenuhi syarat:
   a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

b. memiliki pengalaman di bidang Paten paling kurang 2 (dua) tahun;
c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pemeriksa Paten;
d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(4) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa Paten wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

(1) Bahan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Paten disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Paten yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Paten menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Paten harus dilampiri dengan:

a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan dokumen permohonan Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan substantif permohonan Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penganalisisan hukum terkait dengan Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan/atau

f. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 17

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten yang dinilai dalam pemberian Angka Kreditnya, terdiri dari:

a. unsur utama; dan

b. unsur penunjang.

(2) Unsur utama, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
2. diklat fungsional/teknis di bidang Paten serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan.

b. Pengelolaan dokumen permohonan Paten, meliputi:

1. pencatatan;
2. pemilahan dokumen permohonan sesuai kategori dan bidang substansi;

3. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
4. penataan dokumen.

c. Pemeriksaan substantif permohonan Paten, meliputi:
1. pemeriksaan kelayakan invensi;
2. penganalisisan kejelasan invensi (*clary of invention);*
3. pemeriksaan abstrak;
4. pemeriksaan gambar;
5. penganalisisan klaim;
6. pengklasifikasian;
7. pengklasifikasian ulang;
8. penelusuran;
9. penelusuran tambahan;
10. penentuan kebaruan invensi;
11. penentuan langkah inventif;
12. penentuan keterterapan dalam industri;
13. pelaksanaan komunikasi;
14. pelaksanaan hearing;
15. pelaksanaan Mediasi;
16. pembuatan keputusan;
17. pemeriksaan dampak pemberian Paten terhadap Paten yang masih berlaku;
18. pembuatan surat penarikan; dan
19. supervisi.

d. Penganalisisan hukum terkait dengan Paten, meliputi:
1. penerapan preseden hukum;
2. penentuan kecukupan bukti penggunaan;
3. penentuan Paten ganda;
4. pengevaluasian keterangan ahli tertulis atas suatu referensi yang sama;
5. pemberian keputusan atas permohonan Paten yang telah lebih dahulu digunakan atau diumumkan;
6. pemberian argumen pada Komisi Banding;
7. menjadi saksi ahli;
8. pelaksanaan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan Paten; dan
9. pelaksanaan tugas internalisasi Paten.

e. Pengembangan profesi, meliputi:
1. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Paten;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Paten; dan
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis pemeriksaan Paten.

f. Penunjang tugas Pemeriksa Paten, meliputi:
1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Paten;

2. peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Paten;
3. keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. keanggotaan Tim Penilai;
5. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
6. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemeriksa Paten.

(4) Rincian kegiatan Pemeriksa Paten dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

Pasal 18

(1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Paten harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya.

(3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Paten yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Paten dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Paten dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
   b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(2) Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada:
   a. Pemeriksa Paten yang bersangkutan;
   b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
   c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan
   d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 21

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:
   a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
   b. Pejabat Eselon II yang membidangi Paten bagi Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

(2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
   a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
   b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi Paten yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
   a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan
   b. Pejabat Eselon II yang membidangi Paten untuk Tim Penilai Direktorat.

Pasal 23

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Paten, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Paten.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
   a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
   b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
   c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
   d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.

(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Paten.

(5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Paten, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Paten.

(6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
   a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Paten yang dinilai;
   b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Paten; dan
   c. dapat aktif melakukan penilaian.

(7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7),

dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(9) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.

(10) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(11) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

Pasal 24

(1) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
   a. membantu Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat, yaitu:
   a. membantu Pejabat Eselon II yang membidangi Paten dalam menetapkan Angka Kredit Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan
   b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon II yang membidangi Paten yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Pasal 26

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
(2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu:
a. Pejabat Eselon II yang membidangi Paten kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Pemeriksa Paten Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e;
b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual kepada Pejabat Eselon II yang membidangi Paten untuk Angka Kredit Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

BAB VIII
PENETAPAN ANGKA KREDIT,
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu
Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa Paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Paten, untuk:
   a. Pemeriksa Paten dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.
   b. Pemeriksa Paten dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.
   c. Pemeriksa Paten dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.
(2) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
   a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
   b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 30

(1) Pemeriksa Paten yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Paten, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
   b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
   c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Pedoman pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

Bagian Kedua
Kenaikan Jabatan

Pasal 31

(1) Kenaikan jabatan Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
   a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
   b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
   c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
   d. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.
(2) Kenaikan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Keputusan kenaikan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

(1) Pemeriksa Paten yang akan naik jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat

Pasal 33

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
   a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
   b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
   c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan

Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

(1) Pemeriksa Paten yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

(2) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Paten dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pemeriksa Paten yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pemeriksaan permohonan Paten.

(2) Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Paten Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(3) Pemeriksa Paten Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(4) Pemeriksa Paten Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Paten Ahli Madya pangkat

Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(5) Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(6) Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(7) Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(8) Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

(9) Dalam hal Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina Muda, golongan ruang IV/c yang telah memenuhi Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak tersedia formasi jenjang jabatan Pemeriksa Paten Ahli Utama maka pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan permohonan Paten.

(10) Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan permohonan Paten dan pengembangan profesi.

BAB IX
FORMASI

Pasal 36

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dilaksanakan sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur

negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten didasarkan pada indikator, antara lain:
   a. ruang lingkup pemeriksaan;
   b. jumlah permohonan pemeriksaan substansi; dan
   c. tingkat dan kompleksitas jenis pemeriksaan.

(3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
   a. Pemeriksa Paten Ahli Pertama, paling banyak 56 orang;
   b. Pemeriksa Paten Ahli Muda, paling banyak 45 orang;
   c. Pemeriksa Paten Ahli Madya, paling banyak 40 orang; dan
   d. Pemeriksa Paten Ahli Utama, paling banyak 35 orang.

BAB X
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pembebasan Sementara

Pasal 37

(1) Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdr. Sahat, ST, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006, jabatan Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan pada Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 dengan Angka Kredit sebesar 260, mengingat jabatan Sdr. Sahat, ST, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda yaitu 1 Maret 2009 sampai dengan 28 Februari 2014 tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda.

(2) Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Faizal, ST pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011 dengan Angka Kredit sebesar 210, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda yaitu 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Nopember 2016 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Muda.

(3) Pemeriksa Paten Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Safrimay, ST, Jabatan Pemeriksa Paten Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2008. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dengan Angka Kredit sebesar 552, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberi kenaikan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 Oktober 2010 sampai dengan 30 September 2015 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan Angka Kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2015 dibebaskan

sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Madya.

(4) Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan permohonan Paten dan pengembangan profesi.

(5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemeriksa Paten dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;

b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(6) Pembebasan sementara Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(7) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 38

(1) Pemeriksa Paten yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.

(2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Paten selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 39

(1) Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara karena:
   a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
   b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
   c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; dan
   d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan permohonan Paten dan pengembangan profesi bagi Pemeriksa Paten Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;

   diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan.

(2) Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

(3) Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(5) Pemeriksa Paten yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 41

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksa Paten yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan pemeriksaan permohonan Paten dan pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
b. Pemeriksa Paten yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan
c. Pemeriksa Paten yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 42

(1) Pemeriksa Paten diberhentikan dari jabatannya, apabila:
    a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Paten yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir;
d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan; atau
e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

(2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 43

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pemeriksa Paten dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pemeriksa Paten sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 47/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.6052-KP.04.12 Tahun 2003 dan Nomor 47 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Ketentuan uji kompetensi bagi Pemeriksa Paten yang akan naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku sejak 2 Januari 2015.

Pasal 49

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bjersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 50

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 859

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pemeriksa Paten;

b. .....
.....*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.....
b. NIP :.....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.....
d. Unit kerja :.....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... *)

KETIGA : ..... *)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang bersangkutan; **)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pemeriksa Paten;

b. .....
.....*)

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : .....*)

KETIGA : .....*)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang bersangkutan; **) dan
5. Pejabat lain yang dianggap,perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap ,perlu.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III A:
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	N I P	:
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7	Jabatan fungsional Pemeriksa Paten / TMT	:
8	Masa Kerja golongan lama	:
9	Masa Kerja golongan baru	:
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**UNSUR UTAMA**						
	1 Pendidikan						
	A Pendidikan formal						
	1) Doktor (S-3)						
	2) Magister (S-2)						
	3) Sarjana (S-1)						
	B Diklat Fungsional/Teknis di Bidang Paten						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya 641-960 jam						
	3) Lamanya 481-640 jam						
	4) Lamanya 161-480 jam						
	5) Lamanya 81-160 jam						
	6) Lamanya 31-80 jam						
	7) Lamanya 10-30 jam						
	C Diklat Pra Jabatan						
	Mengikuti diklat prajabatan Golongan III						
	2 Pengelolaan Dokumen Permohonan Paten						
	A Pencatatan						
	Mencatat dokumen permohonan yang diterima:						
	Dokumen permohonan substantif paten sederhana normal dan permohonan paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri.						
	B Pemilahan dokumen permohonan sesuai kategori dan bidang substansi						
	1) Memilah dokumen permohonan sesuai dengan kategori						
	Dokumen permohonan substantif paten sederhana normal dan permohonan paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri.						
	2) Memilah dokumen permohonan sesuai dengan bidang substansi						
	Dokumen permohonan substantif paten sederhana normal dan permohonan paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri.						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C Pemeriksaan kelengkapan dokumen						
	1) Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen						
	Dokumen permohonan substantif paten sederhana normal dan permohonan paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri.						
	2) Memeriksa kelengkapan fisik dokumen						
	Dokumen permohonan substantif paten sederhana normal dan permohonan paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri.						
	D Penataan dokumen						
	1) Memberi label						
	Dokumen permohonan substantif paten sederhana normal dan permohonan paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri.						
	2) Menyusun dokumen permohonan sesuai dengan urutan dan pemohon						
	Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan paten W dengan 3 (tiga) dokumen permohonan substantif klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3 Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten						
	A Pemeriksaan kelayakan invensi						
	1) Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) Menentukan invensi yang diajukan memenuhi Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	B Penganalisaan kejelasan invensi *(clarity of invention)*						
	1) Menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) menganalisis konsistensi:						
	a uraian, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b penggunaan istilah, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	c satuan, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	d simbol, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	C Pemeriksaan abstrak						
	1) Memeriksa jumlah kata di dalam abstrak, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	D Pemeriksaan gambar						
	1) Memeriksa kejelasan gambar invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	E Penganalisisan klaim						
	1) Memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer), dalam:						
	Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) Menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter), dalam:*						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention),* dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	F Pengklasifikasian						
	1) Menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:						
	Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:						
	Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	G Pengklasifikasian ulang						
	1) Menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	H Penelusuran tambahan						
	1) Melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili paten						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) Menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari hasil penelusuran, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	I Penentuan kebaruan invensi						
	Membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	J Penentuan langkah inventif						
	1) Menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Mengidentifikasi masalah, dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) Memformulasikan masalah, dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah, dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	5) Menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	6) Menentukan ketidakterdugaan *(non-obvious)* klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:						
	Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	K Penentuan keterterapan dalam industri						
	Menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	L Pelaksanaan komunikasi						
	1) Membuat surat hasil pemeriksaan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	5) Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	M Pelaksanaan hearing						
	Melakukan diskusi dari isi komunikasi, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	N Pembuatan keputusan						
	Membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali), dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	O Pembuatan surat penarikan kembali						
	1) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses:						
	a Pemeriksaan Paten Sederhana Normal						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4 Penganalisisan Hukum Terkait dengan Paten						
	A Pelaksanaan Ekspose (Panelisasi) Kasus terhadap Permohonan Paten						
	Melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai:						
	1) Panelis						
	2) Pembahas						
	3) Sekretaris						
	B Pelaksanaan Tugas Internalisasi Paten						
	1) Pimpinan untuk forum nasional						
	2) Pimpinan untuk forum internasional						
	3) Pelaksana harian						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5 Pengembangan Profesi						
	A Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang tidak di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam bentuk majalah						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang tidak dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang paten yang disebarkanluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang paten pada pertemuan ilmiah						
	B penerjemahan /penyaduran buku dan/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang paten yang di publikasikan :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang paten yang tidak di publikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan di bidang paten yang dimuat dalam penerbitan						
	C penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis pemeriksaan paten						
	1) Membuat buku pedoman di bidang paten						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang paten						
	3) Membuat ketentuan teknis di bidang paten						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	**UNSUR PENUNJANG**						
	6 Penunjang Tugas Pemeriksa Paten						
	A Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang paten						
	Mengajar/Melatih di bidang paten pada diklat teknis/fungsional bidang pemeriksaan paten						
	B Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang paten						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemrasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2) Mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	3) Mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi pemeriksa paten						
	1) Tingkat Nasional sebagai:						
	a Pengurus aktif						
	b Anggota aktif						
	2) Tingkat Internasional sebagai:						
	a Pengurus aktif						
	b Anggota aktif						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT			
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten									
			Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten								
				a	Tim Penilai Direktorat Jenderal						
				b	Tim Penilai Direktorat						
	E	Perolehan penghargaan/tanda Jasa									
		1)	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya								
			a	30 (tiga puluh) tahun							
			b	20 (dua puluh) tahun							
			c	10 (sepuluh) tahun							
		2)	Memperoleh penghargaan lainnya								
			a	Tingkat Nasional							
			b	Tingkat Internasional							
		3)	Memperoleh gelar kehormatan akademis								
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya									
			Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :								
			1)	Sarjana (S1)							
			2)	Magister (S2)							
			3)	Doktor (S3)							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

LAMPIRAN III B:
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	N I P	:
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7	Jabatan fungsional Pemeriksa Paten / TMT	:
8	Masa Kerja golongan lama	:
9	Masa Kerja golongan baru	:
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	**UNSUR UTAMA**						
	1 Pendidikan						
	A Pendidikan formal						
	1) Doktor (S-3)						
	2) Magister (S-2)						
	3) Sarjana (S-1)						
	B Diklat Fungsional/Teknis di Bidang Paten						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya 641-960 jam						
	3) Lamanya 481-640 jam						
	4) Lamanya 161-480 jam						
	5) Lamanya 81-160 jam						
	6) Lamanya 31-80 jam						
	7) Lamanya 10-30 jam						
	C Diklat Pra Jabatan						
	Mengikuti diklat prajabatan Golongan III						
	2 Pengelolaan Dokumen Permohonan Paten						
	A Pencatatan						
	Mencatat dokumen permohonan yang diterima:						
	Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri.						
	B Pemilahan dokumen permohonan sesuai kategori dan bidang substansi						
	1) Memilah dokumen permohonan sesuai dengan kategori						
	Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri.						

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2					3	4	5	6	7	8	
					Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri.							
	C	Pemeriksaan kelengkapan dokumen										
		1)	Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen									
					Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri							
		2)	Memeriksa kelengkapan fisik dokumen									
					Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri							
	D	Penataan dokumen										
		1)	Memberi label									
					Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri.							
		2)	Menyusun dokumen permohonan sesuai dengan urutan dan pemohon									
					Dokumen permohonan substantif paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri							
	3	**Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten**										
	A	Pemeriksaan kelayakan invensi										
		1)	Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
		2)	Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	B	Penganalisaan kejelasan invensi *(clarity of invention)*										
		1)	Menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
		2)	menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
		3)	menganalisis konsistensi:									
			a.	uraian, dalam:								
				1	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri							
				2	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
				3	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri							
			b.	penggunaan istilah, dalam:								
				1	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri							
				2	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
				3	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri							

NO	UNSUR YANG DINILAI									
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT				
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2					3	4	5	6	7	8
	c. satuan, dalam:										
		1	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		2	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		3	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	d. simbol, dalam:										
		1	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		2	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		3	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	4) Menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar, dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	C Pemeriksaan abstrak										
	1) Memeriksa jumlah kata di dalam abstrak, dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	2) Memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi, dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	D Pemeriksaan gambar										
	1) Memeriksa kejelasan gambar invensi, dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	2) Memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak, dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	E Penganalisisan klaim										
	1) Memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer), dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	2) Menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi, dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	3) Menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter), dalam:*										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	4) Menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention),* dalam:										
		a	Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri								
		b	Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		c	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	F Pengklasifikasian										
	1) Menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:										
			Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri								

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:						
	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	G Pengklasifikasian ulang						
	1) Menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	2) Menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	H Penelusuran tambahan						
	1) Melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili paten						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) Menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	I Penentuan kebaruan invensi						
	Membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	J Penentuan langkah inventif						
	1) Menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Mengidentifikasi masalah, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) Memformulasikan masalah, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	5) Menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	6) Menentukan ketidakterdugaan *(non-obvious)* klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	K Penentuan keterterapan dalam industri						
	Menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri,						
	1) Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	L Pelaksanaan komunikasi						
	1) Membuat surat hasil pemeriksaan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	3) menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	4) Membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	5) Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	M Pelaksanaan hearing						
	Melakukan diskusi dari isi komunikasi, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	N Pembuatan keputusan						
	Membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali), dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	O Pembuatan surat penarikan kembali						
	1) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses:						
	a Pemeriksaan Paten W dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten W dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten P Normal dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	P Supervisi						
	Melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Pertama						
	1) Tahap awal						
	2) Tahap lanjutan						
	3) Tahap akhir						
	4) Penarikan kembali						
	4 Penganalisisan Hukum Terkait dengan Paten						
	A Pelaksanaan Ekspose (Panelisasi) Kasus terhadap Permohonan Paten						
	Melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai:						
	1) Panelis						
	2) Pembahas						
	3) Sekretaris						
	B Pelaksanaan Tugas Internalisasi Paten						
	1) Pimpinan untuk forum nasional						
	2) Pimpinan untuk forum internasional						
	3) Pelaksana harian						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	5 Pengembangan Profesi						
	A Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang tidak di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam bentuk majalah						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang tidak dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang paten yang disebarkanluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang paten pada pertemuan ilmiah						
	B penerjemahan /penyaduran buku dan/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang paten yang di publikasikan :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang paten yang tidak di publikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan di bidang paten yang dimuat dalam penerbitan						
	C penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis pemeriksaan paten						
	1) Membuat buku pedoman di bidang paten						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang paten						
	3) Membuat ketentuan teknis di bidang paten						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	**UNSUR PENUNJANG**						
	6 Penunjang Tugas Pemeriksa Paten						
	A Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang paten						
	Mengajar/Melatih di bidang paten pada diklat teknis/fungsional bidang pemeriksaan paten						
	B Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang paten						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemrasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2) Mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	3) Mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi pemeriksa paten						
	1) Tingkat Nasional sebagai:						
	a Pengurus aktif						
	b Anggota aktif						
	2) Tingkat Internasional sebagai:						
	a Pengurus aktif						
	b Anggota aktif						

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN				ANGKA KREDIT MENURUT				
					INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
					LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	*2*				*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	D	Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten								
			Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten							
			a	Tim Penilai Direktorat Jenderal						
			b	Tim Penilai Direktorat						
	E	Perolehan penghargaan/tanda Jasa								
		1)	Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
			a	30 (tiga puluh) tahun						
			b	20 (dua puluh) tahun						
			c	10 (sepuluh) tahun						
		2)	Memperoleh penghargaan lainnya							
			a	Tingkat Nasional						
			b	Tingkat Internasional						
		3)	Memperoleh gelar kehormatan akademis							
	F	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya								
			Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :							
			1)	Sarjana (S1)						
			2)	Magister (S2)						
			3)	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG										

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

LAMPIRAN III C
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	N I P	:
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7	Jabatan fungsional Pemeriksa Paten / TMT	:
8	Masa Kerja golongan lama	:
9	Masa Kerja golongan baru	:
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**UNSUR UTAMA**						
	1 Pendidikan						
	A Pendidikan formal						
	1) Doktor (S-3)						
	2) Magister (S-2)						
	3) Sarjana (S-1)						
	B Diklat Fungsional/Teknis di Bidang Paten						
	1) Lamanya lebih dari 960 jam						
	2) Lamanya 641-960 jam						
	3) Lamanya 481-640 jam						
	4) Lamanya 161-480 jam						
	5) Lamanya 81-160 jam						
	6) Lamanya 31-80 jam						
	7) Lamanya 10-30 jam						
	C Diklat Pra Jabatan						
	Mengikuti diklat prajabatan Golongan III						
	2 Pengelolaan Dokumen Permohonan Paten						
	A Pencatatan						
	Mencatat dokumen permohonan yang diterima:						
	Dokumen permohonan substantif paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten sederhana Lengkap.						
	B Pemilahan dokumen permohonan sesuai kategori dan bidang substansi						
	1) Memilah dokumen permohonan sesuai dengan kategori						

					Dokumen permohonan substantif paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan substantif paten sederhana Lengkap.							

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						ANGKA KREDIT MENURUT					
							INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	*2*						*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			2)			Memilah dokumen permohonan sesuai dengan bidang substansi						
						Dokumen permohonan substantif paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten substantif sederhana Lengkap.						
		C				Pemeriksaan kelengkapan dokumen						
			1)			Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen						
						Dokumen permohonan substantif paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten substantif sederhana Lengkap.						
			2)			Memeriksa kelengkapan fisik dokumen						
						Dokumen permohonan substantif paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten substantif sederhana Lengkap.						
		D				Penataan dokumen						
			1)			Memberi label						
						Dokumen permohonan substantif paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten substantif sederhana Lengkap.						
			2)			Menyusun dokumen permohonan sesuai dengan urutan dan pemohon						
						Dokumen permohonan substantif paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri, permohonan paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih, dan permohonan paten sederhana Lengkap						
	3	**Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten**										
		A				Pemeriksaan kelayakan invensi						
			1)			Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam:						
				a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
				b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
				c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
			2)			Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam:						
				a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
				b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
				c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
			3)			Menentukan invensi yang diajukan memenuhi Pasal 6 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang paten, dalam Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
		B				Penganalisaan kejelasan invensi *(clarity of invention)*						
			1)			Menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam:						
				a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
				b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
				c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
			2)			menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah, dalam:						
				a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
				b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
				c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
			3)			menganalisis konsistensi:						
				a.		uraian, dalam:						
					1	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
					2	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	b. penggunaan istilah, dalam:						
	1 Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2 Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3 Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	c. satuan, dalam:						
	1 Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2 Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3 Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	d. simbol, dalam:						
	1 Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2 Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3 Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	4) Menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	C Pemeriksaan abstrak						
	1) Memeriksa jumlah kata di dalam abstrak, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	2) Memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	D Pemeriksaan gambar						
	1) Memeriksa kejelasan gambar invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	2) Memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	E Penganalisisan klaim						
	1) Memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer), dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	2) Menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	3) Menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter), dalam:*						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						

				b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
				c	Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
			4)		Menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention)*, dalam:							

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			c	Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap								
	F	Pengklasifikasian										
		1)	Menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			c	Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap								
		2)	Menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			c	Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap								
	G	Penelusuran										
		1)	Melakukan penelusuran untuk mendapatkan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam:									
				Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap								
		2)	Menentukan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)*, dalam:									
				Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap								
		3)	Melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam:									
				Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap								
	H	Penelusuran tambahan										
		1)	Melakukan penelusuran untuk mendapatkan famili paten									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		2)	Melakukan penelusuran berdasarkan klas yang diperoleh, dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		3)	Menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan dari									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		4)	Melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	I	Penentuan kebaruan invensi										
			Membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam:									
			1)	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			2)	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
			3)	Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap								
	J	Penentuan langkah inventif										
		1)	Menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								
			b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
		2)	Mengidentifikasi masalah, dalam:									
			a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri								

				b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			3)		Memformulasikan masalah, dalam:							
				a	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							

NO	UNSUR YANG DINILAI											
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN					ANGKA KREDIT MENURUT						
						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
						LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
				b	Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
		4)			Mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
		5)			Menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
		6)			Menentukan ketidakterdugaan *(non-obvious)* klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
	K	Penentuan keterterapan dalam industri										
					Menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri,							
			1)		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			2)		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			3)		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
	L	Pelaksanaan komunikasi										
		1)			Membuat surat hasil pemeriksaan, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
		2)			Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
		3)			menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
		4)			Membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
		5)			Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:							
			a		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			b		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			c		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
	M	Pelaksanaan hearing										
					Melakukan diskusi dari isi komunikasi, dalam:							
			1)		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			2)		Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
			3)		Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
	N	Pelaksanaan mediasi										
					Melakukan mediasi, dalam:							
					Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap							
	O	Pembuatan keputusan										
					Membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali), dalam:							

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	P Pemeriksaan dampak pemberian paten terhadap paten yang masih berlaku						
	Memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain, dalam:						
	Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	Q Pembuatan surat penarikan kembali						
	1) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum diproses, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	2) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses:						
	a Pemeriksaan Paten P Normal dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Normal dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c Pemeriksaan Paten Sederhana Lengkap						
	P Supervisi						
	Melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Muda						
	1) Tahap awal						
	2) Tahap lanjutan						
	3) Tahap akhir						
	4) Penarikan kembali						
4	**Penganalisisan Hukum Terkait dengan Paten**						
	A. Pelaksanaan Ekspose (Panelisasi) Kasus terhadap Permohonan Paten						
	Melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai:						
	1) Panelis						
	2) Pembahas						
	3) Sekretaris						
	B. Pelaksanaan Tugas Internalisasi Paten						
	1) Penasehat (advisor) di lembaga-lembaga penelitian						
	2) Koordinator pemeriksa antar kantor paten						
	3) Koordinator pemeriksa untuk mediasi paten						
	4) Ketua kelompok Pemeriksa Paten						
	5) Anggota Tim sistem inovasi nasional						
	6) Anggota Tim ekonomi kreatif						
	7) Anggota dewan riset nasional						
	8) Anggota Tim koordinasi perizinan peneliti asing						
	9) Penguji calon pemeriksa paten						
	10) Penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa paten						
	11) Anggota Tim penerapan dan pengkajian teknologi						
	12) Juri lomba inovasi nasional						
	13) Tim pelaksanaan paten						
	14) Pimpinan untuk forum nasional						
	15) Pimpinan untuk forum internasional						
	16) Pelaksana harian						
5	**Pengembangan Profesi**						
	A Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang tidak di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam bentuk majalah						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang tidak dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang paten yang disebarkanluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang paten pada pertemuan ilmiah						
	B penerjemahan /penyaduran buku dan/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang paten yang di publikasikan :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang paten yang tidak di publikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan di bidang paten yang dimuat dalam penerbitan						
	C penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis pemeriksaan paten						
	1) Membuat buku pedoman di bidang paten						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang paten						
	3) Membuat ketentuan teknis di bidang paten						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	**UNSUR PENUNJANG**						
	6 Penunjang Tugas Pemeriksa Paten						
	A Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang paten						
	Mengajar/Melatih di bidang paten pada diklat teknis/fungsional bidang pemeriksaan paten						
	B Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang paten						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemrasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2) Mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	3) Mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi pemeriksa paten						
	1) Tingkat Nasional sebagai:						
	a Pengurus aktif						
	b Anggota aktif						
	2) Tingkat Internasional sebagai:						
	a Pengurus aktif						
	b Anggota aktif						
	D Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten						
	Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten						
	a Tim Penilai Direktorat Jenderal						
	b Tim Penilai Direktorat						
	E Perolehan penghargaan/tanda Jasa						
	1) Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a 30 (tiga puluh) tahun						
	b 20 (dua puluh) tahun						
	c 10 (sepuluh) tahun						
	2) Memperoleh penghargaan lainnya						
	a Tingkat Nasional						
	b Tingkat Internasional						
	3) Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						

				Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :							
				1)	Sarjana (S1)						
				2)	Magister (S2)						
				3)	Doktor (S3)						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG											

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

LAMPIRAN III D
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA
Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :
Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:
2	N I P	:
3	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7	Jabatan fungsional Pemeriksa Paten / TMT	:
8	Masa Kerja golongan lama	:
9	Masa Kerja golongan baru	:
10	Unit Kerja	:

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	
I	**UNSUR UTAMA**							
	1. Pendidikan							
	A. Pendidikan formal							
	1) Doktor (S-3)							
	2) Magister (S-2)							
	3) Sarjana (S-1)							
	B. Diklat Fungsional/Teknis di Bidang Paten							
	1) Lamanya lebih dari 960 jam							
	2) Lamanya 641-960 jam							
	3) Lamanya 481-640 jam							
	4) Lamanya 161-480 jam							
	5) Lamanya 81-160 jam							
	6) Lamanya 31-80 jam							
	7) Lamanya 10-30 jam							
	C. Diklat Pra Jabatan							
	Mengikuti diklat prajabatan Golongan III							
	2. Pengelolaan Dokumen Permohonan Paten							
	A Pencatatan							
	Mencatat dokumen permohonan yang diterima:							
	Dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substantif paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih.							
	B Pemilahan dokumen permohonan sesuai kategori dan bidang substansi							
	1) Memilah dokumen permohonan sesuai dengan kategori							

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih.						
	2) Memilah dokumen permohonan sesuai dengan bidang substansi						
	Dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri mandiri atau lebih.						
	C Pemeriksaan kelengkapan dokumen						
	1) Memeriksa kelengkapan administrasi dokumen						
	Dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih.						
	2) Memeriksa kelengkapan fisik dokumen						
	Dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih.						
	D Penataan dokumen						
	1) Memberi label						
	Dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan substantif paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan substatif paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih.						
	2) Menyusun dokumen permohonan sesuai dengan urutan dan pemohon						
	Dokumen permohonan substantif paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri, permohonan paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri, dan permohonan paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri						
	3. Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten						
	A Pemeriksaan kelayakan invensi						
	1) Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan suatu invensi dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri						
	2) Menentukan permohonan paten yang diajukan merupakan invensi yang dikecualikan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri						
	B Penganalisaan kejelasan invensi *(clarity of invention)*						
	1) Menentukan invensi yang diuraikan di dalam permohonan paten telah jelas dan lengkap , dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri						
	2) menganalisis relevansi antara masalah dan pemecahan masalah,						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) menganalisis konsistensi:						
	a uraian, dalam:						
	1 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	b penggunaan istilah, dalam:						
	1 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	c satuan, dalam:						
	1 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	d simbol, dalam:						
	1 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3 Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	4) Menentukan keterdukungan klaim oleh deskripsi dan gambar,						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	C Pemeriksaan abstrak						
	1) Memeriksa jumlah kata di dalam abstrak, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	2) Memeriksa abstrak yang merepresentasikan invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	D Pemeriksaan gambar						
	1) Memeriksa kejelasan gambar invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	2) Memeriksa relevansi antara gambar dengan deskripsi, klaim dan abstrak, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	E Penganalisisan klaim						
	1) Memeriksa kejelasan klaim (produk, proses/metode, alat/peralatan/sistem, product by process, second medical use, metode bisnis, perangkat lunak komputer), dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	2) Menentukan persoalan pokok *(subject matter)* dari suatu invensi, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) Menentukan batasan-batasan invensi *(critical subject matter), dalam:*						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	4) Menentukan satu kesatuan invensi *(Unity of invention)*, dalam:						

			a	Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri							
			b	Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri							
			c	Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih							
		F		Pengklasifikasian							
			1)	Menentukan klasifikasi utama dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:							

NO	UNSUR YANG DINILAI								
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT							
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI				
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	2) Menentukan klasifikasi tambahan dari suatu invensi berdasarkan Klasifikasi Internasional (IPC), dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	G Penelusuran								
	1) Melakukan penelusuran untuk mendapatkan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	2) Menentukan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)*, dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	3) Melakukan penelusuran internal untuk mencegah terjadinya paten ganda, dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	H Penentuan kebaruan invensi								
	Membandingkan klaim-klaim invensi dengan dokumen pembanding terdekat *(closest prior art)* yang diperoleh dari hasil penelusuran, dalam:								
	1) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	2) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	3) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	I Penentuan langkah inventif								
	1) Menentukan dokumen-dokumen pembanding yang relevan, dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	2) Mengidentifikasi masalah, dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	3) Memformulasikan masalah, dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri								
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih								
	4) Mengidentifikasi fitur-fitur teknis yang mendukung pemecahan masalah, dalam:								
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri								

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	5) Menganalisa efek teknis fitur-fitur klaim invensi terhadap dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	6) Menentukan ketidakterdugaan *(non-obvious)* klaim-klaim invensi berdasarkan kombinasi dokumen-dokumen pembanding tersebut, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	7) Menerapkan teori murni, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri						
	8) Mengevaluasi lingkup klaim, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	9) Mengevaluasi perubahan/amandemen klaim-klaim terhadap						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	10) Menentukan jika pemohon harus diminta untuk membatasi klaim-						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	11) Mengenali dan mengembangkan pengaruh-pengaruh yang mungkin,						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	12) Memutuskan keadaan khusus dimana pemohon mencoba untuk						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	13) Menentukan keefektifan dan/atau kegunaan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	J Penentuan keterterapan dalam industri						
	Menentukan keterterapan klaim-klaim invensi dalam industri,						
	1) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	K Pelaksanaan komunikasi						
	1) Membuat surat hasil pemeriksaan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	2) Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan dan/atau amandemen, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	3) menganalisis surat tanggapan dan/atau amandemen, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	4) Membuat surat hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	5) Menerima surat tanggapan hasil pemeriksaan lanjutan, dalam:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	L Pelaksanaan hearing						
	Melakukan diskusi dari isi komunikasi, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	M Pelaksanaan mediasi						
	Melakukan mediasi, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	N Pembuatan keputusan						
	Membuat keputusan akhir (diberi, ditolak, dianggap ditarik kembali), dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	O Pemeriksaan dampak pemberian paten terhadap paten yang masih berlaku						
	Memberikan saran kepada pemohon paten yang diberikan dalam pelaksanaannya kemungkinan harus melanggar paten orang lain, dalam:						
	1) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	2) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	3) Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	P Pembuatan surat penarikan kembali						
	1) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang belum						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	2) Membuat surat penarikan kembali permohonan yang sedang dalam proses:						
	a Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 1 (satu) klaim mandiri						
	b Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 2 (dua) klaim mandiri						
	c Pemeriksaan Paten P Lengkap dengan 3 (tiga) klaim mandiri atau lebih						
	P Supervisi						
	Melakukan supervisi terhadap hasil pemeriksaan Pemeriksa Paten Madya						
	1) Tahap awal						
	2) Tahap lanjutan						
	3) Tahap akhir						
	4) Penarikan kembali						
	4. Penganalisisan Hukum Terkait dengan Paten						

	A.	Penerapan preseden hukum							
		1)	Melakukan penelitian hukum untuk menentukan the state of law sehubungan dengan masalah hukum yang tidak biasa yang mungkin berkembang dalam proses penuntutan atas permohonan						
		2)	Mengevaluasi preseden kasus yang ditemukan dan menentukan penerapannya dengan kasus yang sedang ditangani						
	B	Penentuan kecukupan bukti penggunaan							
			Mengevaluasi bukti kegunaan dan menentukan pemenuhan aturan hukum untuk tujuan pembuktian kegunaan.						
	C	Penentuan paten ganda							
			Menentukan satu dari beberapa permohonan paten yang sama yang diajukan oleh pemohon.						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	D Pengevaluasian keterangan ahli tertulis atas suatu referensi yang sama							
	Menentukan kelengkapan persyaratan keputusan (diberi atau ditolaknya) suatu permohonan paten berdasarkan keterangan-keterangan ahli yang disampaikan oleh pemohon.							
	E Penentuan legalitas perubahan (ralat)							
	Mengevaluasi laporan pemohon dan bukti untuk menentukan semua persyaratan perubahan (ralat) telah terpenuhi.							
	F Pemberian keputusan atas permohonan paten yang telah lebih dahulu digunakan atau diumumkan							
	Mengevaluasi penjelasan pemohon dengan melakukan:							
	1) dengar pendapat (hearing)							
	2) mempertimbangkan permintaan hak khusus							
	3) membuat keputusan mengenai penggunaan invensi tersebut sebelum dimohonkan patennya							
	G Pemberian argumen pada Komisi Banding							
	Memberikan argumen pada Komisi Banding.							
	H Menjadi saksi ahli							
	Menjadi saksi ahli dalam kasus pelanggaran paten:							
	1) DPR							
	2) Pengadilan							
	3) Kepolisian							
	4) KPPU							
	5) Intansi terkait lainnya							
	I Pelaksanaan Ekspose (Panelisasi) Kasus terhadap Permohonan Paten							
	Melakukan ekspose (panelisasi) kasus terhadap permohonan paten, sebagai:							
	1) Panelis							
	2) Pembahas							
	3) Sekretaris							
	J Pelaksanaan Tugas Internalisasi Paten							
	1) Penasehat (advisor) di lembaga-lembaga penelitian							
	2) Koordinator pemeriksa antar kantor paten							
	3) Koordinator pemeriksa untuk mediasi paten							
	4) Ketua kelompok Pemeriksa Paten							
	5) Anggota Tim sistem inovasi nasional							
	6) Anggota Tim ekonomi kreatif							
	7) Anggota dewan riset nasional							
	8) Anggota Tim koordinasi perizinan peneliti asing							
	9) Penguji calon pemeriksa paten							
	10) Penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa paten							
	11) Anggota Tim penerapan dan pengkajian teknologi							
	12) Juri lomba inovasi nasional							
	13) Tim pelaksanaan paten							
	14) Pimpinan untuk forum nasional							
	15) Pimpinan untuk forum internasional							
	16) Pelaksana harian							
	5. Pengembangan Profesi							

NO	UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	A Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam majalah ilmiah						
	2) Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang paten yang tidak di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
	3) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang di publikasikan:						
	a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b Dalam bentuk majalah						
	4) Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang paten yang tidak dipublikasikan						
	a Dalam bentuk buku						
	b Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah populer di bidang paten yang disebarkanluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang paten pada pertemuan ilmiah						
	B penerjemahan /penyaduran buku dan/karya ilmiah di bidang paten						
	1) Menerjemahkan/menyadur buku di bidang paten yang di publikasikan :						
	a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b Majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) Menerjemahkan/menyadur di bidang paten yang tidak di publikasikan dalam bentuk :						
	a Buku						
	b Makalah						
	3) Membuat abstrak tulisan di bidang paten yang dimuat dalam penerbitan						
	C penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis pemeriksaan paten						
	1) Membuat buku pedoman di bidang paten						
	2) Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang paten						
	3) Membuat ketentuan teknis di bidang paten						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	**UNSUR PENUNJANG**						
	6 Penunjang Tugas Pemeriksa Paten						
	A Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang paten						
	Mengajar/Melatih di bidang paten pada diklat teknis/fungsional bidang pemeriksaan paten						
	B Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang paten						
	1) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai :						
	a Pemrasaran						
	b Pembahas/moderator/narasumber						
	c Peserta						
	2) Mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	3) Mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
	a Ketua						
	b Anggota						
	C Keanggotaan dalam organisasi profesi pemeriksa paten						
	1) Tingkat Nasional sebagai:						
	a Pengurus aktif						

				b	Anggota aktif							
			2)		Tingkat Internasional sebagai:							
				a	Pengurus aktif							
				b	Anggota aktif							
		D			Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten							
					Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten							
				a	Tim Penilai Direktorat Jenderal							
				b	Tim Penilai Direktorat							
		E			Perolehan penghargaan/tanda Jasa							
			1)		Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
				a	30 (tiga puluh) tahun							
				b	20 (dua puluh) tahun							
				c	10 (sepuluh) tahun							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2) Memperoleh penghargaan lainnya							
	a Tingkat Nasional							
	b Tingkat Internasional							
	3) Memperoleh gelar kehormatan akademis							
	F Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :							
	1) Sarjana (S1)							
	2) Magister (S2)							
	3) Doktor (S3)							
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

*) Dicoret yang tidak perlu

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan ..... 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	.....,..... NIP.
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	.....,..... (Nama Penilai I) NIP. .....,..... (Nama Penilai II) NIP.
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (N a m a) NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN V
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUISA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGELOLAAN
DOKUMEN PERMOHONAN PATEN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN DOKUMEN PERMOHONAN PATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengelolaan dokumen permohonan paten sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
PERMOHONAN PATEN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF PERMOHONAN PATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan substantif permohonan paten sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGANALISISAN HUKUM
TERKAIT DENGAN PATEN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGANALISISAN HUKUM TERKAIT DENGAN PATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penganalisisan hukum terkait dengan paten sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA
PATEN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS PEMERIKSA PATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
Jabatan : .....
Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas pemeriksa paten sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR: .....

Instansi: ..... Masa Penilaian: .....

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri KARPEG				
	4	Pangkat/Golongan ruang TMT				
	5	Tempat dan Tanggal lahir				
	6	Jenis Kelamin				
	7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya				
	8	Jabatan Fungsional/TMT				
	9	Unit Kerja				
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA				
		A	Pendidikan 1) Pendidikan formal			
			2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Paten dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)			
			3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan			
		B	Pemeriksaan Permohonan Paten			
		C	Pengembangan Profesi			
		Jumlah Unsur Utama				
	2.	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Pemeriksa Paten				
		Jumlah Unsur Penunjang				
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN ..... / PANGKAT ..... / TMT.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pemeriksa Paten yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; *) dan
4. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

Nama Lengkap
NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :.....
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;

b. .....
.....*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten jenjang ..... ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....).

KEDUA : ..... *)
KETIGA : ..... *)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan; **) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....
KEPADA YTH. : .....
ALAMAT : .....
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
   Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol. Ruang : .....
   Jabatan : .....
   Unit kerja : .....

   sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah .....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan ..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....
pada tanggal : .....

NIP.

Tembusan:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; *)
3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Paten yang bersangkutan; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/ golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal .....;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... *)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :.....
pada tanggal :.....

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. bKepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan; yang bersangkutan; **) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR :.....

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten;

b. .... *);

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
d. Unit kerja : .....
Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... *)

KETIGA : ..... *)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan; yang bersangkutan; **) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu.

**) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2014
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : .....
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN
KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN **)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang :
a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/ golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten:
a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
d. Unit Kerja : .....

KEDUA : ..... *)

KETIGA : ..... *)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....
pada tanggal .....

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; **)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Biro Keuangan/Bagian Keuangan; yang bersangkutan **) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
**) Coret yang tidak perlu perlu.